

東北大学

シ

学生  
正勇○陳 重男  
松本 順一郎

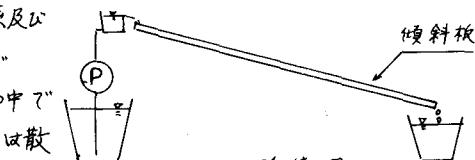
1. 序：散水汙床の除去モデルについて 一般には 擬均相系及び異相系が提唱されている。擬均相系の場合には Howland 及び Schulze の研究より 基質の残存率は  $\frac{C_e}{C_0} = \exp^{-kt}$  ( $t = \frac{C_0 - C_e}{Qk}$ ) の形で考慮されている。滞留時間  $t$  (mean time) は散水量及び膜の厚さに關係があることをすでに筆者は指摘した。今

今回の研究は更にその依存性を明確にし、上記のパラメーター  $b$  及び  $C$  の膜の厚さとの關係も考察した。また、高流入濃度で培養した生物膜は脱離しやすいう現象を観察した。

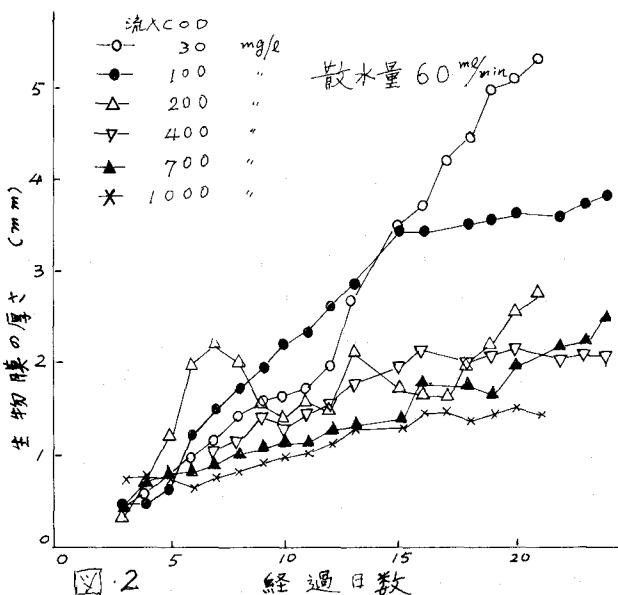
2. 実験装置：図・1 に示したようにプロテスキック板を用いた長さ 300 cm, 幅 5 cm の三つの傾斜板汙床を作った。水平から角度を  $7^\circ$  とした。汙床の流入口で overflow を工夫して定量  $60 \text{ ml/min}$  で散水した。また滞留時間をイオン濃度計で測定し、生物膜の厚さはノギスで測定した。

3. 実験条件及び実験方法：散水量は 60  $\text{ml/min}$  の同一条件とし、COD 濃度  $30, 100, 200, 400, 700, 1000 \text{ ppm}$  のスキムミルク基質で培養した。また濃度が  $100 \text{ ppm}$  の場合には膜の厚さが  $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \text{ mm}$  のとき散水量は  $15, 30, 45, 60, 90, 120, 150$  のように変化させた。このとき滞留時間測定のため、1 cc の飽和食塩水を汙床の入口で瞬時に注入し、出口の  $\text{Cl}^-$  濃度変化を測定した。汙床の排除汚泥量についてミニフレンチルターメーター (AP 40) を用いて流入と流出口の SS 量を測定した。実験のデータは散水開始から大量の生物膜の脱離が生じる時までについて採取した。

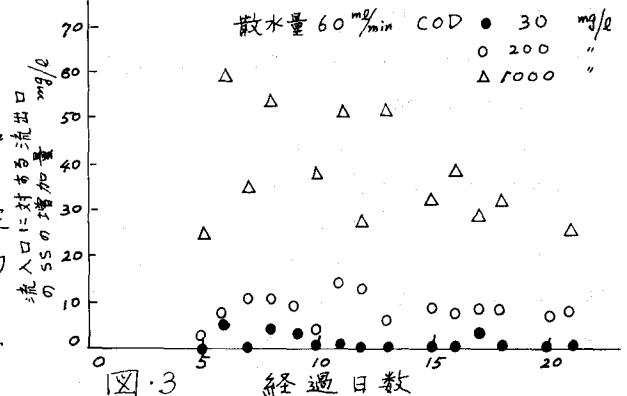
4. 考察：流入基質濃度を変化させた実験での汙床における生物膜の厚さの経日変化を図・2 に示す。一般に生物の増殖は流入基質濃度に依存することにあるが、本実験では  $100 \text{ ppm}$  をこえる高流入濃度の場合に、汙床における生物付着量がかえり減少していく傾向が表われ、膜の増加状態も不安定となる。これは図・3 に示す汙床の排除汚泥量の経日変化からも、脱離の程度が理解されると思われる。あらわち高濃度の場合には必ず脱離現象が起り、この脱離量が流入濃度とともに増加する。この現象は Heukelink 及び



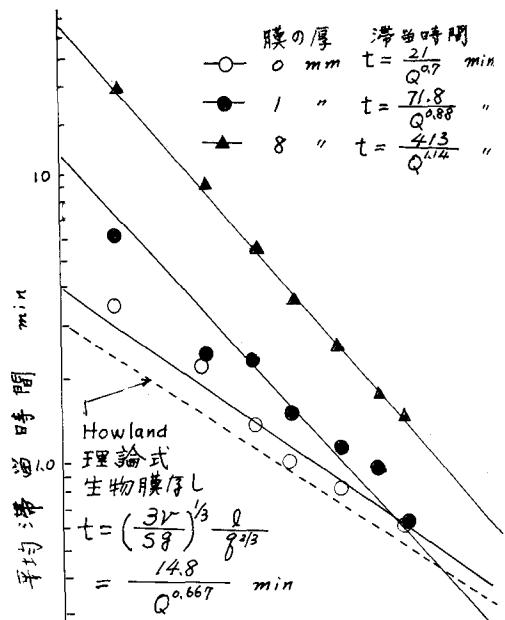
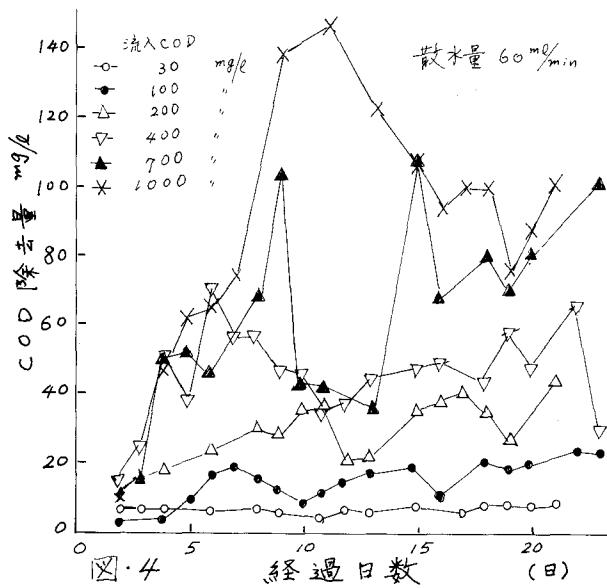
図・1 実験装置



図・2



図・3



Sanders はここで経験的に指摘したことがある。だが具体的なデータが示されてゐるか? 膜の脱離の原因は 散水量、振動、角度などの物理的原因のほか、膜の底部の生物の死滅、嫌気性に關する報告されてゐるが、生物の付着構造と同様に 脱離現象の濃度依存性はまだ十分解明されてゐない。この構造を解明あるには 生物膜の性状を定量的に把握する必要があると思われる。なお、Sanders は脱離の周期が 11~14日であると報告しているが、流入基質が高濃度の場合には 膜がたえず少量の脱離を生じてゐるため、その周期を本実験から明確に観察あることが難しいと判断せられる。図・4 は COD 除去量の経日変化を示す。流入濃度の増加とともに 基質の除去量も著しく増加する。しかし 400, 700, 1000 ppm の場合、大きな変動が観察される。これは 膜がたえず脱離するため、沪床が一時的にふくられたと考えられる。図・5 は 膜の厚さをパラメーターとした場合の平均滞留時間  $t$  の散水量  $Q$  への依存性を示す。異なる膜の厚さに対して  $t$  と  $Q$  を対数でプロットすると 直線関係が得られる。これは Howland 及び Schulze の式と一致する。しかし Bloodgood は 滞留時間  $t$  が 膜の有無に関係なく(ほぼ) 同程度の値であると報告している。Schulze は  $b$  の値が  $\frac{2}{3}$  であることを報告した。本研究では 図・6 から明らかのように  $b$  及び  $C$  は 膜の厚さに依存している。また 生物膜が厚いときの実験式  $t = \frac{21}{Q^{0.67}} \text{ min}$  と Howland の理論式  $t = \left(\frac{3V}{5g}\right)^{1/3} \frac{l}{g^{2/3}} = \frac{14.8}{Q^{0.667}} \text{ min}$  とは 大差がないことを図・5 に示した。 $b$  及び  $C$  と、膜の厚さとの関係はここに 筆者によつて明らかにされた。それらは また多くの他の因子に複雑に關してあるものと思われる。図・6 に示したように関係は 実際の沪床の評価に役立つものと思われる。

参考文献 (1) 松本・陳、昭53年土木年次大会講演集 P710. (2) Bloodgood. Sewage Works Vol. 31, No. 3, p 243. (3) Schulze. JWPCF Mar. 1960, p 245. (4) Howland. IWC, Purdue Univ. 1958, p 435. (5) Sanders. Inst. J. p 253.

